

10; 12

© 1990 г.

**ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЯ ТОРОИДАЛЬНОГО ТИПА  
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ ЭНЕРГОАНАЛИЗАТОРЕ  
С ОГРАНИЧИВАЮЩИМИ ЭЛЕКТРОДАМИ**

*M. I. Явор*

Решается задача синтеза энергоанализатора с заданным распределением электростатического поля вблизи оси пучка. С этой целью разработан специальный аналитический метод расчета поля. Предложена конструкция анализатора с малыми aberrациями второго и третьего порядков, в котором фокусное расстояние может регулироваться в широких пределах изменением потенциалов на ограничивающих электродах.

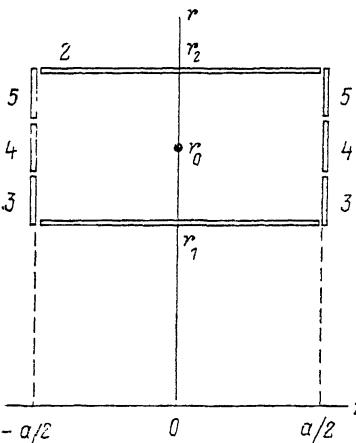
В высокопрецизионных статических масс-спектрометрах и электронных спектрометрах в качестве электростатического каскада часто используется тороидальный энергоанализатор [1]. Однако широкое применение его ограничено из-за сложности формы электродов и необходимости изготовления их с высокой точностью. Последнее объясняется тем, что форма электродов полностью определяет фокусирующие и дисперсионные свойства анализатора, а электрическая юстировка его невозможна.

С целью упрощения конструкции и введения возможности электрической регулировки параметров в работе [2] была предложена конструкция дефлектора, сочетающего отклоняющие цилиндрические и два дополнительных плоских кольцевых электрода, расположенных симметрично относительно средней плоскости и перпендикулярно оси цилиндрических электродов (идея дополнительных ограничивающих электродов была впоследствии использована и в котробчатом анализаторе [3]). В таком дефлекторе поле вблизи оси пучка близко к полю тороидального конденсатора, а электрическая регулировка достигается путем изменения потенциала на плоских ограничивающих электродах. Позднее в работе [4] была предложена модификация описанного устройства, заключающаяся в том, что каждый из плоских ограничивающих электродов выполнен в виде двух концентрических электрически изолированных колец, на которые подаются различные потенциалы. Новая конструкция расширила возможности электрической регулировки параметров энергоанализатора.

Наибольший практический интерес при расчете дефлектора с ограничивающими электродами представляет решение задачи синтеза, т. е. расчет геометрии электродов и потенциалов на них таких, которые обеспечивают заданное распределение поля вблизи оси пучка. Этому и посвящена настоящая работа. Метод решения, разработанный в ней, позволил установить, что конструкции, описанные в работах [2, 4], имеют существенные недостатки, главным из которых является большая величина aberrаций третьего порядка. Предложена усовершенствованная конструкция энергоанализатора, для которого aberrации третьего порядка малы. Показано, что в таком анализаторе электрическая юстировка величин aberrаций сможет проводиться раздельно от юстировки параметров первого порядка (фокусного расстояния и дисперсии).

Основой решения поставленной задачи является разработка аналитического метода расчета потенциала электростатического поля в анализаторе, поскольку известные методы — численные [5] или метод разделения переменных [6] — являются для решения задачи синтеза трудоемкими. Переайдем к описанию

этого метода применительно к расчету дефлектора, состоящего из двух соосных цилиндрических электродов с радиусами  $r_1$  и  $r_2$ , ограниченных системой концентрических кольцевых электродов, расположенных в плоскостях, перпендикулярных оси цилиндрических, симметрично относительно средней плоскости  $z=0$ . Кольцевые электроды соосны цилиндрическим, расстояние между плоскостями, в которых расположены кольцевые электроды, равно  $a$ . Предполагается, что, во-первых, зазоры между соседними кольцевыми, а также крайними кольцевыми и соответствующими цилиндрическими электродами пренебрежимо малы и, во-вторых, величина зазора  $b=r_2-r_1$  между цилиндрическими электродами значительно меньше их радиусов  $\varepsilon=b/r_1 \ll 1$ . На рис. 1 показано сечение электродов аксиальной плоскостью для случая, когда число пар кольцевых электродов равно трем.



Введем переменные  $\xi=(r-r_1)/b$ ,  $v=z/b$  и обозначим  $\alpha=a/b$ . Потенциал электростатического поля энергоанализатора является решением уравнения Лапласа

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon \xi} \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial^2 u}{\partial v^2} = 0 \quad (1)$$

с граничными условиями

Рис. 1. Энергоанализатор с тремя парами ограничивающих электродов.

Потенциалы на электродах: 1 —  $u=0$ , 2 —  $V$ , 3 —  $Vv_1$ , 4 —  $Vv_2$ , 5 —  $Vv_3$ .

$$u(0, v) = 0; \quad u(1, v) = V; \quad u\left(\xi, \pm \frac{\alpha}{2}\right) = Vv_i(\xi), \quad (2)$$

где  $v(\xi)$  — кусочно-постоянная функция.

Решение задачи (1), (2) пишем в виде ряда

$$u(\xi, v) = \sum_{j=0}^{\infty} u_j(\xi, v) \xi^j. \quad (3)$$

Подстановка (3) в (1) и (2) приводит к рекуррентной последовательности уравнений

$$\Delta u_0 = 0, \quad \Delta u_j = -\frac{\partial u_{j-1}}{\partial \xi} + \xi \frac{\partial u_{j-2}}{\partial \xi} - \dots + (-1)^j \xi^{j-1} \frac{\partial u_0}{\partial \xi}, \quad j \geq 1, \quad (4)$$

где  $\Delta = \partial^2 / \partial \xi^2 + \partial^2 / \partial v^2$  с граничными условиями (2) для функции  $u_0$  и однородными граничными условиями для  $u_j$  при  $j \geq 1$ .

Функцию  $u_0$  можно представить в виде  $u_0 = V(U_0 + w_0)$ , где  $U_0$  и  $w_0$  — решения уравнения Лапласа с граничными условиями  $U_0(\xi, -a/2) = U_0(\xi, a/2) = U_0(0, v) = 0$ ,  $U_0(1, v) = 1$ ,  $w_0(\xi, -a/2) = w_0(\xi, a/2) = v(\xi)$ ,  $w_0(0, v) = w_0(1, v) = 0$ . Нетрудно убедиться, что

$$U_0(\xi, v) = \xi + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \frac{\operatorname{ch}(\pi n v)}{\operatorname{ch}(\pi n \frac{\alpha}{2})} \sin(\pi n \xi),$$

$$w_0(\xi, v) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{\operatorname{ch}(\pi n v)}{\operatorname{ch}(\pi n \frac{\alpha}{2})} \sin(\pi n \xi), \quad (5)$$

где  $a_n$  — коэффициенты Фурье разложения

$$v(\xi) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(\pi n \xi).$$

Обозначим  $\mu = \exp(-\pi\alpha/2)$ . Если  $\alpha \geq 1$ , что будет предполагаться в дальнейшем, то параметр  $\mu$  является малым. Раскладывая функции  $\text{ch}^{-1}(\pi\alpha/2)$  в (5) по степеням  $\mu$ , получим

$$u_0(\xi, 0) = V \left( \xi + 2d_1\mu \sin(\pi\xi) + 2d_2\mu^2 \sin(2\pi\xi) + 2[d_3 \sin(3\pi\xi) - d_1 \sin(\pi\xi)]\mu^3 + O(\mu^4) \right), \quad (6)$$

где

$$d_1 = a_1 - 2/\pi, \quad d_2 = a_2 + 1/\pi, \quad d_3 = a_3 - 2/(3\pi).$$

Перейдем к определению функции  $u_1$ . Представим ее в виде

$$u_1(\xi, v) = V \left\{ \frac{1}{2} [(1 - \xi) U_0(\xi, v) - \xi w_0(\xi, v)] + w_1(\xi, v) \right\}. \quad (7)$$

Подставляя (7) в (4), получим, что  $w_1$  является решением уравнения Папласа с граничными условиями  $w_1(0, v) = w_1(1, v) = 0$ ,  $w_1(\xi, -\alpha/2) = w_1(\xi, \alpha/2) = \xi w_0(\xi)/2$ , т. е. может быть записана в виде

$$w_1(\xi, v) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{\text{ch}(\pi nv)}{\text{ch}(\pi n \frac{\alpha}{2})} \sin(\pi n \xi),$$

где  $b_n$  — коэффициенты Фурье разложения

$$\xi v(\xi) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(\pi n \xi).$$

Окончательно имеем

$$u_1(\xi, 0) = V \left\{ \frac{1}{2} \xi (1 - \xi) + \left[ \frac{2}{\pi} (\xi - 1) - a_1 \xi + b_1 \right] \mu \sin(\pi \xi) + \left[ \frac{1}{\pi} (1 - \xi) - a_2 \xi + b_2 \right] \mu^2 \sin(2\pi \xi) + O(\mu^3) \right\}. \quad (8)$$

Аналогичным путем, хотя и несколько сложнее, можно получить выражения для функций  $u_j$  при  $j \geq 2$ .

Используем полученные результаты для описания распределения поля вблизи оси пучка заряженных частиц, являющейся окружностью радиуса  $r_0 = (r_1 + r_2)/2$ . Одним из способов такого описания является введение набора параметров  $c_k$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots$ , выражения для которых имеют вид

$$c_k = \left( \frac{r_0}{b} \right)^k \frac{\partial^k}{\partial \xi^k} \left[ \frac{r_0}{R(\xi)} \right]_{\xi=1/2},$$

где  $R(\xi)$  — радиус кривизны линии пересечения эквипотенциала поля с плоскостью, проходящей через ось  $z$ , в точке с координатами  $(\xi, 0)$  пересечения этой линии со средней плоскостью  $v=0$ . Смысл введения величин  $c_k$  состоит в том, что они входят как параметры в уравнения траекторий заряженных частиц в дефлекторе [7], причем параметр  $c_0$  определяет фокусирующие и дисперсионные свойства аналлизатора в параксимальном приближении,  $c_1$  — aberrации второго порядка,  $c_2$  — третьего и т. д. Параметры  $c_k$  могут быть выражены [8] через производные от функции  $u(\xi, 0)$  на оси пучка  $\xi=0.5$ , и наоборот. Используя приведенные в [8] результаты, а также выражения (6), (8) и аналогичные формулы для функций  $u_2$  и  $u_3$ , получим с точностью до малых поправок следующие формулы для параметров  $c_0$ ,  $c_1$  и  $c_2$ :

$$\begin{aligned} c_0 &= C_0 + \gamma_0, \\ c_1 &= C_1 + 2c_0 + c_0^2 - \frac{3}{2} C_0 + \gamma_1, \\ c_2 &= C_2 + 3c_1(1 + c_0) - c_0(6 + 3c_0 + c_0^2) + \gamma_2, \end{aligned} \quad (9)$$

где

$$C_0 = \frac{2\pi^2 d_1 u}{\varepsilon},$$

$$C_1 = -16\pi^3 d_2 \left(\frac{\mu}{\varepsilon}\right)^2,$$

$$C_2 = -2\pi^4 \frac{\mu}{\varepsilon^3} (d_1 - 81d_3 u^2),$$

$$\gamma_0 = \pi^2 (d_1 + g_1) \mu - \frac{2\mu^3 \pi^2}{\varepsilon} (9d_3 + d_1[1 - 4\pi d_2]) + 2\pi^2 d_1^2 u^2 -$$

$$- \varepsilon \mu \left\{ \frac{d_1}{2} - \pi^2 \left( h_1 + \frac{d_1}{6} + \frac{g_1}{2} \right) \right\},$$

$$\gamma_1 = -8\pi^3 (g_2 + 2d_2) \frac{\mu^2}{\varepsilon} - 3\pi^2 (d_1 - h_2) \mu,$$

$$\begin{aligned} \gamma_2 = & -\frac{\pi^4 \mu}{\varepsilon^2} [g_1 + 3(d_1 - 81d_3 \mu^2)] + 2\pi^4 d_1 (1 - 4\pi d_2) \left(\frac{\mu}{\varepsilon}\right)^3 - \\ & - 2\pi^3 \left(\frac{\mu}{\varepsilon}\right)^2 [-16d_2 + \pi(d_1 - 81d_3 \mu^2) d_1] - \frac{\pi^2 \mu}{\varepsilon} \left\{ \pi^2 \left( h_1 + \frac{d_1}{6} + \frac{3g_1}{2} \right) + \right. \\ & \left. + \frac{3}{2} [d_1 - 81d_3 \mu^2] \right\} - 9d_1, \end{aligned}$$

$$g_1 = -\frac{1}{\pi} - \frac{a_1}{2} + b_1,$$

$$g_2 = \frac{1}{2\pi} - \frac{a_2}{2} + b_2,$$

$$h_1 = \frac{5}{8\pi} - \frac{1}{\pi^3} + \left( \frac{3}{16} - \frac{\ln \mu}{4\pi^2} \right) a_1 - \frac{b_1}{4} - \frac{f_1}{2} + \frac{\ln u}{2\pi^3},$$

$$h_2 = -\frac{1}{2\pi} + \frac{3a_1}{4} - \frac{b_1}{2},$$

$$f_1 = \int_0^1 \xi^2 v(\xi) \sin(\pi \xi) d\xi.$$

Формулы, аналогичные (9), можно получить и для параметров  $c_k$  с более высокими номерами. Точность формул (9) проверялась путем сравнения результатов расчетов по этим формулам с результатами, получаемыми методом разделения переменных [6] для энергоанализатора со сплошными ограничивающими электродами [2] (в этом случае  $v(\xi) = \omega = \text{const}$ ). Такое сравнение показало, что параметры  $c_k$  определяются по формулам (9) с точностью 0.1—0.2 %. Вместе с тем эти формулы существенно проще формул, получаемых методом разделения переменных.

Заметим, что каждая из величин  $C_k$  зависит лишь от  $k$  первых коэффициентов  $a_m$ , а слагаемые  $\gamma_k$  в (9) являются малыми по сравнению с  $C_k$ . Последнее обстоятельство позволяет для решения задачи синтеза (т. е. определения функции  $v(\xi)$ , сводящегося к расчету коэффициентов  $a_m$ ) энергоанализатора с заданным параметрами  $c_k$  распределением поля вблизи оси пучка эффективно применять метод последовательных приближений. При этом на каждом шаге параметры  $a_m$  легко восстанавливаются по значениям  $C_k$ . Разумеется, число возможных задаваемых независимо от параметров  $c_k$  и соответственно число определяемых коэффициентов  $a_m$  зависит от максимально возможного количества участков постоянства функции  $v(\xi)$ , т. е. от того, сколько кольцевых электродов расположено в каждой из ограничивающих плоскостей.

Рассмотрим сначала дефлектор, предложенный в работе [2]. Коэффициенты  $a_m$  разложения функции  $v(\xi)$ , являющейся постоянной со значением  $\omega$ , равны

$a_1=4\omega/\pi$ ,  $a_2=0$ ,  $a_3=4\omega/(3\pi)$  и т. д. Для такого энергоанализатора можно решать задачу синтеза поля с заданными значениями параметров  $c_0$  и  $c_1$ , варьируя значения  $\mu$  (аксиального размера анализатора) и  $\omega$ . Задача решается методом последовательных приближений, причем на каждом шаге значения  $\mu$  и  $\omega$  восстанавливаются по величинам  $C_0$  и  $C_1$ . Заметим, однако, что, поскольку  $C_1 < 0$ , то из (9) следует, что в первом приближении (без учета поправок  $\gamma_0$ ,  $\gamma_1$ ) всегда выполняется соотношение  $c_1 < c_0^2 + c_0/2$ . Таким образом, не для любых заданных значений  $c_0$  и  $c_1$  можно подобрать такие величины  $\mu$  и  $\omega$ , чтобы эти значения реализовались.

Кроме того, если величина  $\varepsilon$  имеет порядок 0.1, то для того, чтобы параметры  $c_0$  и  $c_1$  были порядка единицы, необходимо  $\omega \sim 1$ ,  $a \sim 3$ . В этом случае  $81d_3\mu^2 \ll d_1$  и в первом приближении  $c_2 = -\pi^2\varepsilon^{-2}c_0$ , т. е.  $c_2$  является большой величиной порядка  $10^3$ . Иначе говоря, исследуемый анализатор обладает большими aberrациями третьего порядка, причиной которых является быстрое

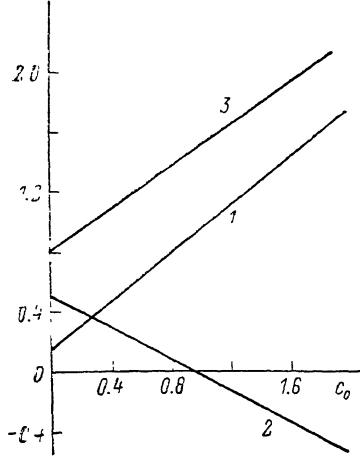


Рис. 2.

1 —  $v_1$ , 2 —  $v_2$ , 3 —  $v_3$ .

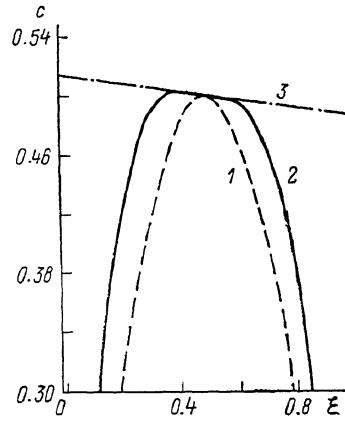


Рис. 3.

1 — энергоанализатор с двумя парами ограничивающих электродов, 2 — с тремя парами, 3 — тороидальный дефлектор.

изменение аксиальной кривизны эквипотенциалей поля при удалении от оси пучка.

Модернизация энергоанализатора, предпринятая в работе [3], обеспечила возможность независимой электрической регулировки параметров  $c_0$  и  $c_1$  при фиксированной геометрии анализатора (постоянном  $\mu$ ). В модернизированной конструкции каждый из ограничивающих электродов разрезан на две кольцевые части, радиальные размеры которых равны  $r_1 < r < r_0$  и  $r_0 < r < r_2$ . В этом случае функция  $v(\xi)$  принимает значения  $v_1$  при  $0 < \xi < 0.5$  и  $v_2$  при  $0.5 < \xi < 1$ . Коэффициенты  $a_1$  и  $a_2$  связаны с «нормированными» потенциалами  $v_1$  и  $v_2$  соотношениями  $a_1=2(v_1+v_2)/\pi$ ,  $a_2=2(v_1-v_2)/\pi$ . Для рассматриваемого дефлектора при любых значениях  $c_0$  и  $c_1$  можно найти потенциалы  $v_1$  и  $v_2$ , реализующие эти значения. Однако можно показать, что в модернизированном анализаторе, так же как и в первоначально рассматривавшемся, aberrации третьего порядка велики.

Для уменьшения aberrаций можно предложить использовать конструкцию энергоанализатора с тремя парами кольцевых электродов (рис. 1), радиальные размеры которых равны соответственно  $r_1 < r < r_1+b/3$ ,  $r_1+b/3 < r < r_1+2b/3$ ,  $r_1+2b/3 < r < r_2$ . При этом функция  $v(\xi)$  может принимать различные значения  $v_1$  при  $0 < \xi < 1/3$ ,  $v_2$  при  $1/3 < \xi < 2/3$  и  $v_3$  при  $2/3 < \xi < 1$ . Тогда коэффициенты  $a_1$ ,  $a_2$  и  $a_3$  имеют вид  $a_1=(v_1+2v_2+v_3)/\pi$ ,  $a_2=3(v_1-v_3)/(2\pi)$ ,  $a_3=4(v_1-v_2+v_3)/(3\pi)$ . Задавшись произвольными значениями  $c_0$ ,  $c_1$  и  $c_2$ , можно путем решения системы уравнений (9) методом последовательных приближений рассчитать соответствующие значения  $v_1$ ,  $v_2$  и  $v_3$ . Удобно, например, потребовать выполнения соотношений  $c_1=-c_0^2$ ,  $c_2=2c_0^3$ , которые имеют место в тороидальном энергоанализаторе с совпадающими аксиальными центрами кривизны. При этом

коэффициенты aberrаций второго и третьего порядков предлагаемого энергоанализатора будут совпадать с соответствующими коэффициентами aberrаций тороидального дефлектора с таким же значением  $c_0$ . На рис. 2 приведены зависимости нормированных потенциалов  $v_1$ ,  $v_2$  и  $v_3$  от  $c_0$  для такого случая при размерах анализатора  $r_1=200$  мм,  $b=20$  мм,  $a=40$  мм.

Улучшение распределения поля вблизи оси пучка в дефлекторе с тремя парами ограничивающих электродов по сравнению с анализатором, описанным в [4], иллюстрируется рис. 3, где показана зависимость величины  $c(\xi) = r_0/R(\xi)$  от  $\xi$  (предполагается  $\epsilon=0.1$ ,  $\alpha=2$ ). Потенциалы  $v_k$  подобраны таким образом, чтобы для всех рассматриваемых анализаторов выполнялись условия  $c_0=c(0)=0.5$ ,  $c_1=-c_0^2$ , а для анализатора с тремя парами ограничивающих электродов, кроме того,  $c_2=2c_0^3$ . Из графиков видно, что для дефлектора с тремя парами ограничивающих электродов аксиальная кривизна эквипотенциалей при изменении  $\xi$  в пределах  $1/3 < \xi < 2/3$  меняется значительно меньше, чем для анализатора, рассматривавшегося в [4] (в первом случае кривизна меняется в пределах 4 % своей величины, во втором — 15 %). Таким образом, распределение поля в предлагаемом энергоанализаторе близко к распределению поля в тороидальном дефлекторе в значительно более широкой окрестности оси пучка. Это позволяет в анализаторе с тремя парами ограничивающих электродов пропускать с малыми aberrациями пучки с радиальной шириной, достигающей  $b/3$ .

Еще одно удобство предлагаемого дефлектора заключается в возможности электрической юстировки aberrаций при сохранении неизменными его фокусирующих свойств первого порядка. Например, подавая на ограничивающие электроды дополнительные юстировочные потенциалы одинаковой величины, но с чередующимся знаком ( $\Delta v_1 = -\Delta v_2 = \Delta v_3$ ), мы получим изменение коэффициента  $a_3$  при постоянных  $a_1$  и  $a_2$  и, как следует из (9), в первом приближении (без учета поправок  $\gamma_k$ ) изменение параметра  $c_2$  при постоянных  $c_0$  и  $c_1$ . Таким образом, будут изменяться коэффициенты aberrаций третьего порядка, а параксимальные свойства и коэффициенты aberrаций второго порядка останутся неизменными.

Сформулируем окончательные выводы. Исследование свойств анализаторов, описанных в [2, 4], позволило установить, что они непригодны к использованию в высокопрецизионных электронных и масс-спектрометрах, так как обладают большими aberrациями третьего порядка. Этот недостаток устранен в предложенном в работе дефлекторе с тремя парами ограничивающих электродов. Такой анализатор несложен в изготовлении, а потенциалы на ограничивающих электродах, формирующие требуемое распределение поля, рассчитываются аналитически. Кроме того, он удобен тем, что допускает независимую электрическую юстировку различных параметров.

### Список литературы

- [1] Афанасьев В. П., Явор С. Я. Электростатические энергоанализаторы для пучков заряженных частиц. М., 1978. 224 с.
- [2] Matsuda H. // Rev. Sci. Instr. 1961. Vol. 32. N 7. P. 850—852.
- [3] Афанасьев В. П., Явор С. Я. // Письма в ЖТФ. 1975. Т. 1. Вып. 17. С. 779—782.
- [4] Hu Zhao-Heng, Wang Guo-Liang, Matsuda H., Boerboom A. J. H., // Mass Spectr. (Japan). 1987. Vol. 35. N 5. P. 312—315.
- [5] Matsuda H., Fujita Y. // Int. J. Mass Spectr. Ion Phys. 1975. Vol. 16. N 4. P. 395—404.
- [6] Цирлин Л. Э. Избранные задачи расчета электрических и магнитных полей. М., 1977. 320 с.
- [7] Matsuo T., Matsuda H., Wollnik H. // Nucl. Instr. Meth. 1972. Vol. 103. N 3. P. 515—532.
- [8] Wollnik H., Matsuo T., Matsuda H. // Nucl. Instr. Meth. 1972. Vol. 102. N 1. P. 13—17.

Научно-техническое объединение  
Институт аналитического приборостроения АН СССР  
Ленинград

Поступило в Редакцию  
20 декабря 1988 г.